PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Application Number

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Filing Date	08/11/2003
First Named Inventor	Han-Tu Lin
Group Art Unit	
Examiner Name	

10/604,686

			Examiner Name		
Total Number of	Pages in This Submi	ssion 3	Attorney Docket Nu	mber ADTP0093USA	
ENCLOSURES (check all that apply)					
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/dec Extension of Time R Express Abandonme Information Disclosu Certified Copy of Pri Document(s) Response to Missing Incomplete Application	claration(s) equest ent Request ure Statement ority	Assignment (for an	to Convert to a nal Application of Correspondence	After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Book of Appeals and Interference Appeal Communication to Gook (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter	Board es Group
•	Missing Parts R 1.52 or 1.53				
	SIGNATU	RE OF APPLI	CANT, ATTORNEY,	OR AGENT	
Firm or Individual name	Winston Hsu,	Reg. No.: 4	11,526		
Signature	Winters Hay				
Date 87-91-003					
CERTIFICATE OF MAILING					
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:					
Typed or printed name	,				
Signature	n is estimated to take 0.	2 hours to complete	e Time will vary dependir	Date Date page 1 and 1	comments
I hereby certify that this commail in an envelope address Typed or printed name Signature Burden Hour Statement: This form	n is estimated to take 0.2	CERTIFICATION OF Patents, Was	ATE OF MAILING The United States Postal Schington, DC 20231 on	Service with sufficient postage as first of this date:	comments

on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 0 3 2003 ESTATE TRADEMINATION

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

Compl t if Known			
Application Number	10/604,686		
Filing Date	8/11/2003		
First Named Inventor	Han-Tu Lin	•	
Examiner Name			
Art Unit			
Attorney Docket No.	ADTP0093USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES				S		
Deposit Account:	<u>Large</u> l	Entity	Small	Entity		
Deposit Account 50-0801	Fee Code		Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Number	1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account Name North America International Patent Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
The Commissioner is authorized to: (check all that apply)	1053	130	1053	130	Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
FEE CALCULATION	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC FILING FEE	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
F <u>ee Fee Fee Fee Description</u> Fee Paid Code (\$)	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330 2002 165 Design filing fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00		110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
	1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims below Fee Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee	
Independent	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Claims - 3** = X = X Multiple Dependent	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	750	2809		Filing a submission after final rejection	
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3					(37 CFR 1.129(a))	
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid 1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims	1810	750	2810	375	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
over original patent	1801	750	2801	375	Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Redu	ced by	Basic F	Filing Fe	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
SUBMITTED BY (Complete (if applicable)						

SUBMITTED BY

Name (Print/Type)

Winston Hsu

Registration No. (Attorney/Agent)

Ali,526

Telephone 886289237350

Date

Date

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

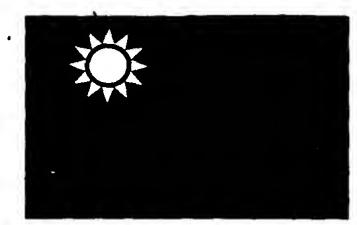
This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE work Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

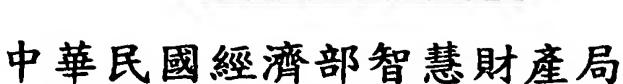
DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO		
092113643	Taiwan, R.O.C.	05/20/2003				
	·					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



यित येत येत येत



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日:西元 2003 年 05 月 20 日

Application Date

申 請 案 號: 092113643

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局 長 Director General

Director deficitur



發文日期: 西元 2003 年 8 月 4 日

Issue Date

發文字號: 09220783840

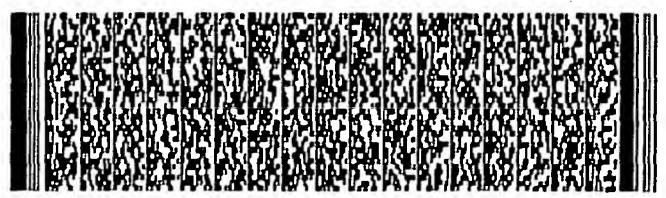
Serial No.





申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
	中文	有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法		
發明名稱	英 文	METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY		
	姓名(中文)	1. 林漢塗		
-	姓 名 (英文)	1.Lin, Han-Tu		
發明人 (共2人)	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW		
	住居所(中 文)	1. 台中縣梧棲鎮自立一街二五0號		
	住居所 (英 文)	1. No. 250, Chih-Li 1st St., Wu-Chi Town, Tai-Chung Hsien, Taiwan, R.O.C.		
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司		
9	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.		
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW		
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)		
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin- Chu City, Taiwan, R. O. C.		
·	代表人(中文)	1. 李焜耀		
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao		



申請日期:	·	IPC分類
申請案號:		
(以上各欄)	由本局填記	發明專利說明書
	中文	
發明名稱	英 文	
	姓 名 (中文)	2. 來漢中
-1	姓 名 (英文)	2. Lai, Han-Chung
發明人 (共2人)	國籍(中英文)	2. 中華民國 TW
		2. 桃園縣中壢市內壢成功路一二二巷六十三弄二十號
	住居所(英文)	2. No. 20, Alley 63, Lane 122, Cheng-Kung Rd., Nei-Li, Chung-Li City, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
三	國 籍 (中英文)	
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人 (英文)	

四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)

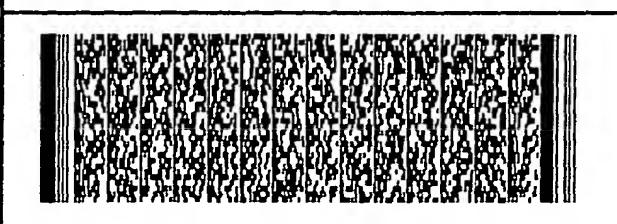
五、(一)、本案代表圖為:第 六 圖 (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

40 基板

42 閘極

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

A method for forming a thin film transistor (TFT) of an organic light emitting display is povided. The method comprises providing a substrate, depositing a first metal layer, performing a photo-etching-process (PEP) to form a gate of the TFT on the substrate, forming a gate insulating layer, a microcrystalline silicon layer, an amorphous silicon layer, and a doped n⁺





四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)

44 **閘極絕緣層** 46 微晶矽層 48 非晶矽層 50 掺雜半導體層 52 氧化銦錫層 54 源極 56 保護層 汲 極 5 8 60有機發光層

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

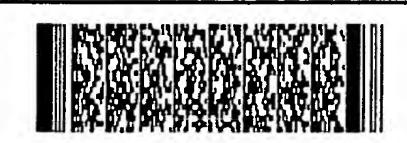
layer sequentially, then performing a second PEP to remove portions of the doped n⁺ layer, the algrphous silicon layer, and the microcrystalline silicon layer, forming a second metal layer, performing a third PEP to form a source and a drain on the substrate, to remove portions of the doped n⁺ layer to expose the amorphous silicon layer, and finally forming a passivation layer on



四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)。

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

the substrate.



國家(沙區)申請專利 申請日期 家號 主张專利法第二十四條第一項優先報 無 二、□主張專利法第二十五條之一第一項優先權: 申請案號: 無 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 等存機構: 等存機構: 寄存充竭。: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存充竭。: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存充竭。: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存充竭。: □執習該項技術者易於獲得,不須寄存。	一、本案已向		·
二、□主張專利法第二十五條之一第一項優先權: 申請案號: 無 三、主張本案條符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 無 寄存機構: 寄存中期: 寄存號码: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存時機:	國家(地區)申請專利	申請日期 案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
 二、□主張專利法第二十五條之一第一項優先權: 申請案號: 無 三、主張本案條符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存時期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存機構: 寄存過期: 無 等存號碼: 	•		
二、□主張專利法第二十五條之一第一項優先權: 申請案號: 無 三、主張本案條符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 無 寄存機構: 寄存中期: 寄存號码: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存時機:			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 無	8	無	
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 無			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 無			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 無			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □「有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 寄存日期: 無			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □「有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 寄存日期: 無			
申請案號: 田期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 無			
無 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存機構: 寄存日期: 無 寄存日期: 寄存機構: 寄存日期: 無	二、□主張專利法第二十五个	條之一第一項優先權:	
日期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存中期: 寄存時期: 無	申請案號:	<u>r</u>	
日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 新存日期: 新存品期:	日期:	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 新存日期: 新存號碼:	三、主張本案係符合專利法	第二十條第一項□第一款但書或□第	第二款但書規定之期間
寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 新存日期: 新存號碼:	日期:		
寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 新存日期: 新存日期: 新存號碼:	四、「有關微生物已客在於	岡 外・	
寄存機構: 無 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存機構: 寄存日期: 無 寄存號碼:			
寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 無 寄存號碼:	寄存機構:	無	
□有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 寄存日期: 無 寄存號碼:			
寄存日期: 無寄存號碼:		國內(本局所指定之寄存機構):	
寄存號碼:	寄存機構:	*	

		獲得,不須寄存。	

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

本發明係關於一種有機發光顯示器(organic light emitting display)之薄膜電晶體(thin film transistor, TFT)的製作方法,尤指一種能改善薄膜電晶體之閘極啟始電壓飄移問題的薄膜電晶體製作方法。

先前技術

隨著科技的日新月異,輕薄、省電、可攜帶式的智慧 2 資訊產品已經充斥了我們的生活空間,而顯示器直質 在其間扮演了相當重要的角色。近年來顯示器在高畫質、大畫面、低成本的需求下已有很大進步,其中在有機材料的成功開發之下,有機發光顯示器以簡單的架構和具備自發光、極佳的工作溫度、高解析度、高對比、廣視角等優勢,已逐漸在顯示器市場中受到矚目,甚至有凌駕於液晶顯示器 (liquid crystal display, LCD)或是陰極射線管 (cathode ray tube, CRT)顯示器之上的趨勢,可運用在手機、PDA、數位相機、掌上型遊戲機、攜型 DVD播放機及汽車導航器等面板上。

有機發光顯示器係利用有機發光元件 (例如有機發光二極體, organic light emitting diode, OLED)為顯示器之光源,由於有機發光元件本身為一電流驅動元件,



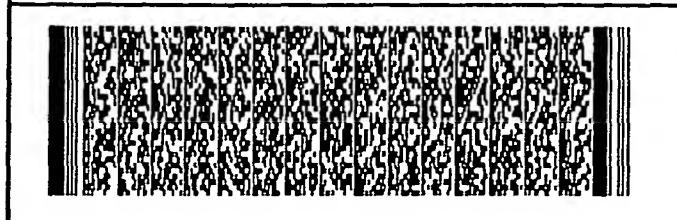


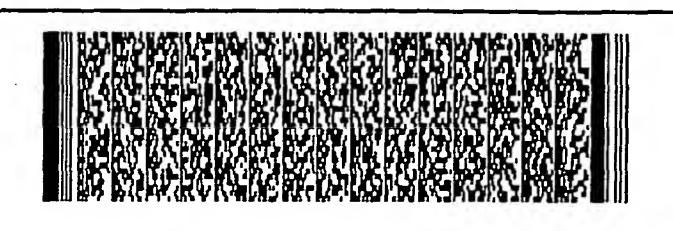
五、發明說明 (2)

能根據所通過電流之大小產生不同亮度的光線,故在矩陣式顯示器中,即是藉由控制有機發光元件之驅動電流的大小,來達到顯示不同亮度(又稱為灰階值)的效果,因此有機發光顯示器可充分利用此種特性來產生不同灰階強度的紅、藍、綠光,進一步使顯示器產生色彩豐富的影像。

而根據驅動方式之差異,有機發光顯示器可分為被動式矩陣 (passive matrix)顯示器與主動式矩陣 (active matrix)顯示器兩種。被動式矩陣顯示器是採用循序驅動掃 i線的方式,逐一驅動位於不同行/列上的畫素,因此每一行/列上的畫素之發光時間會受限於顯示器之掃描頻率以及掃描線數目,較不適用於大畫面以及高解析度(表示掃描線增加)之顯示器。主動式矩陣顯示器則於每一個畫素中形成獨立的畫素電路,包括一電容器(capacitor, Cs)、一 OLED發光元件以及至少二薄膜電晶體,以利用畫素電路來調節 OLED之驅動電流的大小,因此即使在大畫面以及高解析度之要求下,仍然可以持續提供每一畫素一穩定驅動電流,改善顯示器之亮度均勻性。

請參考圖一,圖一為習知一主動矩陣式有機發光顯示器10之基本架構圖。如圖一所示,一顯示面板12上包含有由複數行資料線 (例如 DL1、 DL2及 DL3)與複數列掃描





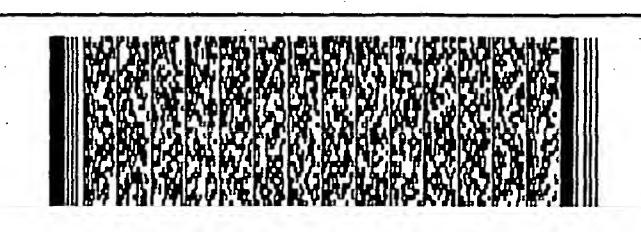
五、發明說明 (3)

線 (例如 SL1與 SL2)所構成的矩陣,以及複數個由薄膜電晶體、電容以及有機發光元件等電子元件 (未顯示)所構成之畫素電路 26,分別設置於每一條資料線與每一條掃描線的交會處。為便於說明,圖一中僅顯示一個畫素電路 26,實際上,顯示面板 12中每一條資料線 22與掃描線 24的交接處 (intersection)均設有一畫素電路 26,分別電連接到對應的資料線 22與掃描線 24,且每一畫素電路 26均係對應於一個畫素,以驅動該畫素內的有機發光元件 20。資料線 DL1、 DL2及 DL3等係連接至一外部資料線驅動電路 16,以接收一影像資料信號,而掃描線 SL1與 SL2等 刊係連接至一外部掃描線驅動電路 18,以接收一開關/定址信號。

請參考圖二,圖二為圖一所示畫素電路 26之電路示意圖。如圖二所示,畫素電路 26包含有一第一薄膜電晶體 28、一第二薄膜電晶體 30以及一儲存電容 32,在習知技術中,第一、第二薄膜電晶體一般係使用 NMOS電晶體。其中第一電晶體 28之 閘極與汲極 (點 A)係分別電連接於掃描線 24與資料線 22,第二電晶體 30之 閘極 (點 B)係電連接於第一電晶體 28之源極與儲存電容 32之一端,且第二電晶體 30之源極 (點 C)與汲極 (點 D)分別電連接到一外部電源 Vd與有機發光元件 20。

習知有機發光顯示器10的驅動原理係說明如下,請

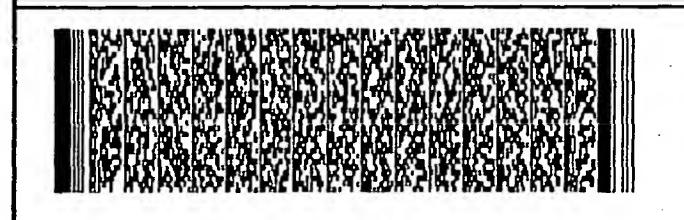




五、發明說明(4)

参考圖一與圖二,當一影像資料信號輸入控制電路 14時,控制電路 14會根據各畫素所需要顯示的資料產生相對應的控制信號並分別輸入資料線驅動電路 16及掃描線驅動電路 18將依序對每一條掃描線 24 (SL1~SLn)送出對應的掃描信號,以依次開啟各列畫素電路 26,並對各列畫素進行顯示操作。例如當有機發光顯示器 10欲驅動位於 DL3與 SL3交會處之畫素時,控制電路 14會經由掃描線 22將一掃描信號輸入畫素電路 26中第一薄膜電晶體 28的汲極。

由於此時第一薄膜電晶體 28與第二薄膜電晶體 30均會處於導通狀態,因此來自資料線 22處之電流將會經 第一薄膜電晶體 28對儲存電容 32進行充電,使儲存電容 32具有一第一電壓,並在點 C處產生一相對應的驅動電流輸出至有機發光元件 20,以使有機發光元件 20產生對應之亮方 高點示器 10進行後續顯示操作時,例如驅動下一行畫素時,雖然掃描線 SL3上的電壓將下降而使第一薄電圖體 28關閉,然而由於儲存電容 32中仍然具有一第一電壓,因此第二電晶體 30將會被維持在導通狀態,又由於點 D與點 C間具有一電壓差,因此會持續產生電流經由第二薄膜電晶體 30輸出至有機發光元件 20,使有機





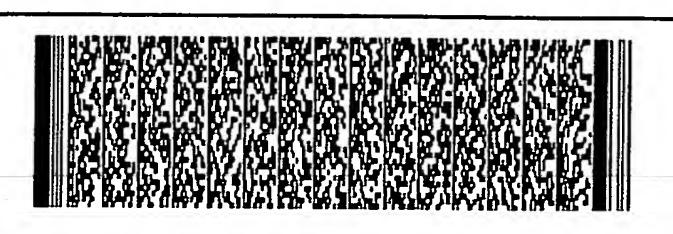
五、發明說明 (5)

發光元件 20持續維持在發光狀態。由於畫素電路設計結構之不同,在一畫素電路中所含有之薄膜電晶體的數量也不盡相同,但一畫素電路至少含有二薄膜電晶體,以完成有機發光元件之驅動。

由上述有機發光顯示器之驅動原理可知,負責驅動有機發光元件之畫素電路為一有機發光顯示器是否能即時顯示出完整及正確資料畫面的關鍵之一,而薄膜電晶體又為畫素電路中主要控制畫素電路導通與否及供應有機發光元件持續發光的重要元件,因此薄膜電晶體的良莠 直常為有機發光顯示器品質好壞的重要因素。

習知有機發光顯示器之畫遠電路所使用的薄膜電晶體一般為NMOS電晶體,其製程係先在一玻璃基底上形成一閘極,再依序覆蓋以一閘極絕緣 (gate insulating layer, GI)層、一非晶矽 (amorphous silicon)層以及一掺雜 (doped)半導體層 (n layer),並移除部分之該掺雜半導體層及該非晶矽層以定義出該閘極圖案。隨後再於該職基底上形成一氧組錫 (indium tin oxide, ITO)層,移除部份之氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)層,移除部份之氧化銦錫層以形成畫素電極。接著於該層半導體層上形成一金屬層,再進行一黃光暨蝕該薄釋半導體層上形成一金屬層,時職層層,形成該薄膜電晶體之一源極與一及極,並同時曝露出部分之該非晶矽層。最後在該源極與汲極上形成一保護層

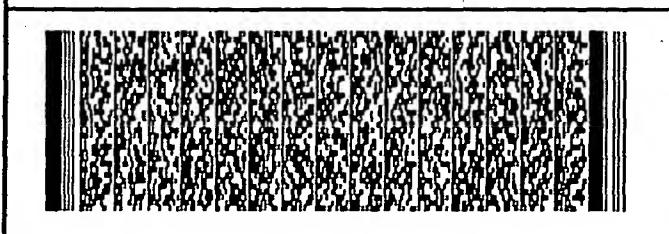


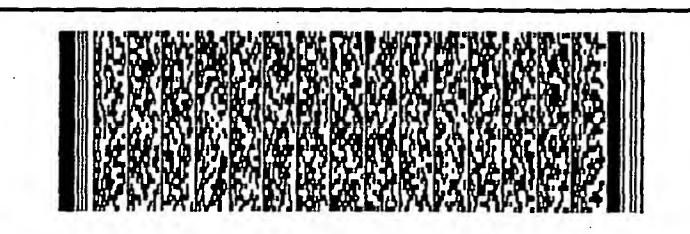


五、發明說明 (6)

(passivation layer),並去除部份之保護層,便完成該有機發光顯示器之該薄膜電晶體之製作。

現階段的OLED製造商大多是引進低溫多晶矽薄膜電晶體 (low temperature polysilicon thin film transistor, LTPS TFT)的製程,來改善原薄膜電晶體閘極起始電壓飄移之問題,然而因為LTPS TFT之製程相對較複雜,良率不高,造價亦相對較為昂貴,故在有機發光顯示器之製造中,如何以簡單、低成本之含氫的非晶





五、發明說明 (7)

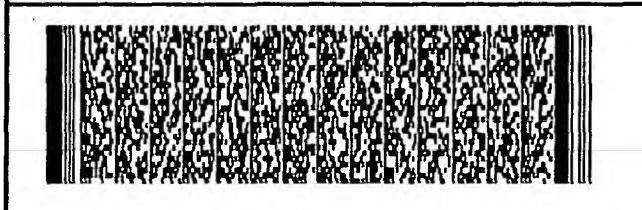
矽層 (hydrogenated amorphous silicon layer, α-Si: layer)製程來生產出提供穩定閘極起始電壓之薄膜電晶體為當前業界急需解決的問題。



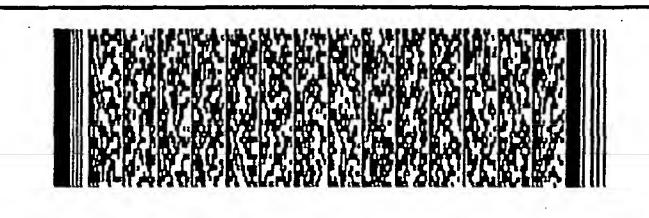
發明內容

因此本發明之目的在於提供一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,以解決上述因閘極啟始電壓飄移而造成亮度不均的問題。

根據本發明,一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法包含:提供一基板,於該基板上沈積一第一金屬層,接著對該第一金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程(photo-etching-process,PEP),以於該基板表面形成的薄膜電晶體之一間極,然後於該間極表面形成一間極絕緣層,再於該間極絕緣層上形成一微晶矽(microcrystalline silicon)層,接著於該微晶矽層上依次形成一非晶矽層及一掺雜半導體層(n layer),隨後進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之該掺雜半導體層、然後再於該基板上形成一第二金屬層,進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於寶曆、該非晶矽層,進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於時去除部份之該掺雜半導體層,以曝露出該非晶矽層,



最後於該基板上形成一保護層。



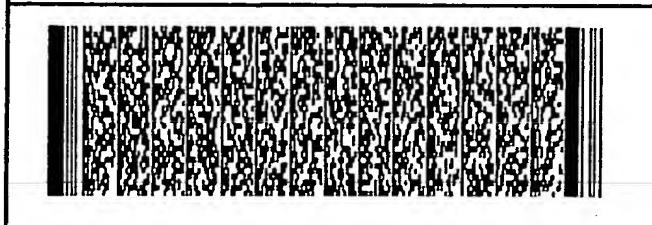
五、發明說明 (8)

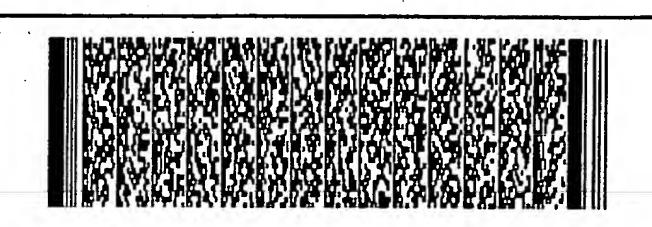
由於本發明之薄膜電晶體的製作方法係以簡單之製程,在閘極絕緣層上多形成一微晶矽層,因此可以避免習知技術中,薄膜電晶體之閘極起始電壓飄移之情形,如此,則可改善有機發光顯示器之顯示品質,進而延長顯示器之壽命。

實施方式

請參閱圖三至圖六,圖三至圖六為本發明形成一有機、光顯示器之一薄膜電晶體的方法示意圖。如圖三所示,首先在基板 40上沈積一第一金屬層,並對該金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於基板 40表面形成該薄膜電晶體之一閘極 42。其中,基板 40係為一玻璃基板、石英基板或塑膠基板,而構成閘極 42之材料包含有鎢(W)、鋁(A1)、鉻(Cr)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。

接著於閘極 42上形成一由氧化矽 (silicon oxide, SiO_x , 例如 SiO_2)、氮化矽 (silicon nitride, SiN_y)或氮氧化矽 (oxynitride, SiON)所構成之閘極絕緣層 44,然後再於閘極絕緣層 44上依序形成一微晶矽層 46、一非晶矽層 48以及一掺雜半導體層 $(n^+ layer)$ 50。其中閘極絕緣層 44、微晶矽層 46及非晶矽層 48係皆利用同一電漿增





五、發明說明 (9)

強化學氣相沈積製程連續沈積形成。

值得注意的是,在本發明中,微晶矽層 46之厚度係以約50~500埃為較佳,而且以電漿增強化學氣相沈積製程形成微晶矽層 46時,該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度 (power density)需控制在小於 0.54瓦特/平方公分的條件為較佳。此外,微晶矽層 46之結晶比率 (f_c)必須大於 40%才能達到電性穩定的要求,此可利用傅立葉轉





五、發明說明 (10)

换紅外線光譜儀 (FTIR)之 2100公分 一级 1900 公分 一级 收峰的積分面積比計算所得,其公式如下:

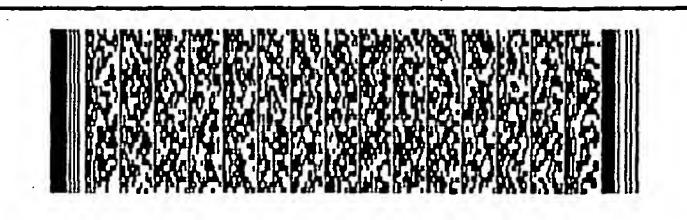


 $f_c = I_{2100}/(I_{2100}+I_{1900})$

在本發明製作一有機發光顯示器之一薄膜電晶體之方法的第二實施例中,係在完成開極絕緣層 44沈積後,先對開極絕緣層 44進行一表面處理製程,再繼續沈積微晶矽層 46。進行該表面處理製程的原因是由於在開極絕緣層 44與微晶矽層 46之介面中,若含有較多的含氧分別自動物量 46之形成,因此本發明便利用一輕微之氧化氮電漿處理製程(N2O plasma treatment),以使開極絕緣層 44能和形成於其上的微晶矽層 46之間有較強的氧鍵結,而達到介面穩定的效果。其中,該表面處理製程也可以利用一含氧電漿處理製程(oxide plasma treatment),亦能使開極絕緣層 44和微晶矽層 46之介面部分有較強的氣鍵結,而該含氧電漿處理製程所使用的含氧氣體可為一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、二氧化氮(H2O2)、氧(O2)、臭氧(O3)或四乙氧基矽烷(TEOS)等氣體。

在本發明之第三實施例中,閘極絕緣層 44以及微晶矽層 46係以非連續程序沈積形成。例如在利用電漿增強化學氣相沈積製程形成閘極絕緣層 44之後,先將基板 40

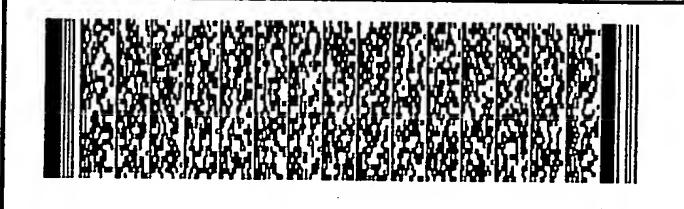


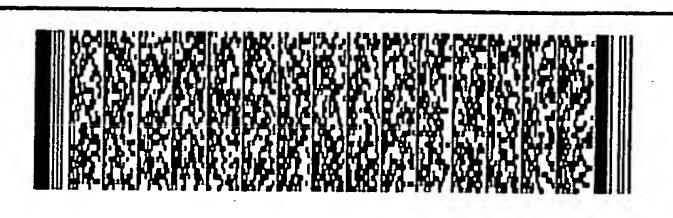


五、發明說明 (11)

移出原反應室 (chamber),然後再將基板 40移至同一反應室或不同反應室,繼續進行微晶矽層 46之沈積。以此程序所製作之微晶矽層 46,可使薄膜電晶體具有穩定性較佳之性質,而能有效達到降低閘極起始電壓之飄移的效果。

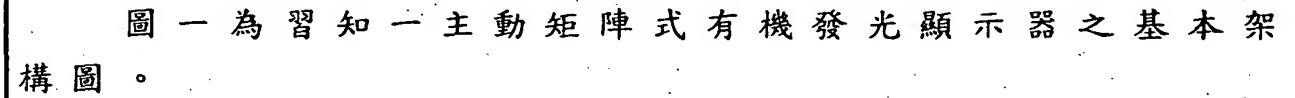
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明



圖二為圖一所示畫素電路之電路示意圖。

圖三至圖六為本發明形成一有機發光顯示器之一薄膜電晶體的方法示意圖。

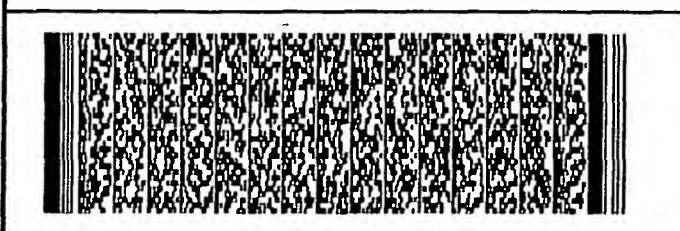
圖式之符號說明

56

汲 極

有機發光層

有機發光顯示器 12 顯示面板 10 16 資料線驅動電路 控制電路 14 掃描線驅動電路 20 有機發光元件 24 掃描線 22 資 料 線 28 第一薄膜電晶體 26 畫素電路 第二薄膜電晶體 32 储存電容 30 基板 40 42 閘極 閘極絕緣層 46 44 微晶矽層 48 非晶矽層 50 搀雜半導體層 52 氧化銦錫層 54 源極



58

保護層

1. 一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,該方法包含有下列步驟:

提供一基板;

於該基板上沈積一第一金屬層;

對該第一金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一閘極;

於該 閘極表面形成一 閘極絕緣層;

於該閘極絕緣層上形成一微晶矽層;

於該微晶矽層上形成一非晶矽層;

於該非晶矽層上形成一掺雜半導體層(n+layer);

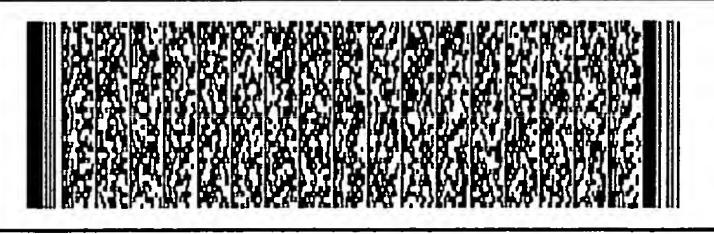
進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之該掺雜半導體層、該非晶矽層以及該微晶矽層;

於該基板上形成一第二金屬層;

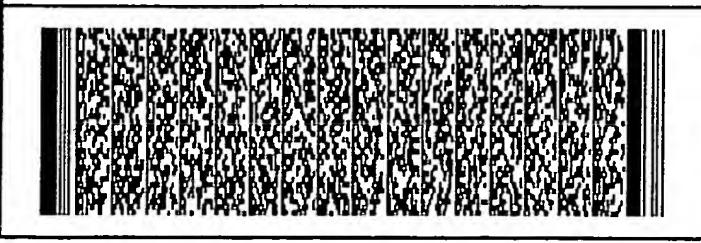
進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一源極與一汲極,並同時去除部份之該摻雜半導體層,以曝露出該非晶矽層;以及

於該基板上形成一保護層。

- 2. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該基板係為玻璃基板、石英基板或塑膠基板。
- 3. 如申請專利範圍第1項之方法,其中構成該第一與該第二金屬層的材料係包含有鷂(W)、鉻(Cr)、鋁(A1)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。



- 4. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該閘極絕緣層係利用一電漿增強化學氣相沈積 (PECVD)製程所形成,且構成該閘極絕緣層的材料係包含有氧化矽 (SiO_x)、氮化矽 (SiN_y)或氮氧化矽 (oxynitride, SiON)。
- 5. 如申請專利範圍第 1項之方法,另包含有一氧化氮 (N₂O)電漿處理製程,用來對該閘極絕緣層進行一表面處理,以使該閘極絕緣層與後續形成之微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 6. 如申請專利範圍第1項之方法,另包含有一含氧電漿處理製程,用來對該閘極絕緣層進行一表面處理,以使該閘極絕緣層與後續形成之微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 7. 如申請專利範圍第 6項之方法,其中該含氧電漿處理製程包含有氧化氮 (NO_x) 、二氧化氮 (H_2O_2) 、氧 (O_2) 、臭氧 (O_3) 或四乙氧基矽烷 (TEOS)等含氧氣體。
- 8. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該微晶矽層係利用一電漿增強化學氣相沈積(PECVD)製程所形成,且該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度小於0.54瓦特/平方公分。



- 9. 如申請專利範圍第8項之方法,其中該微晶矽層之厚度約50至500埃,且該微晶矽層之結晶比率(fc)係大於40%。
- 10. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該閘極絕緣層、該微晶矽層、該非晶矽層皆係利用同一電漿增強化學氣相沈積(PECVD)製程連續沈積形成。
- 11. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該閘極絕緣層以及该微晶矽層係利用電漿增強化學氣相沈積製程非連續沈積形成。
- 12. 如申請專利範圍第1項之方法,其中構成該保護層之材料包含有氧化矽或氮化矽。
- 13. 一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,該方法包含有下列步驟:

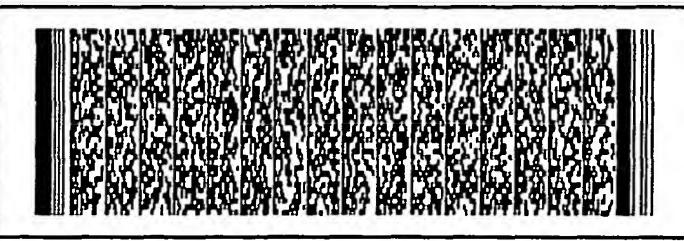
提供一基板;

於該基板上沈積一第一金屬層;

對該第一金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一閘極;

於該閘極上形成一閘極絕緣層;

在該閘極絕緣層表面進行一表面處理製程;



於該閘極絕緣層表面形成一微晶矽層;

於該微晶矽層上形成一非晶矽層;

於該非晶矽層上形成一掺雜半導體層 (n+layer);

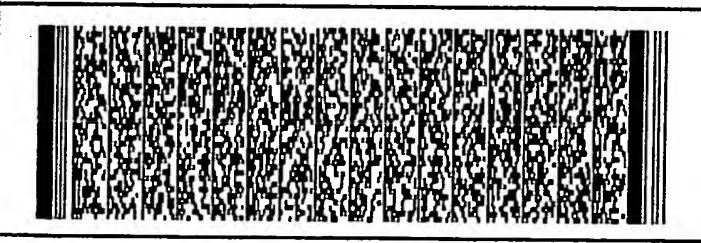
進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之該掺雜半導體層、該非晶矽層以及該微晶矽層;

於該基板上形成一第二金屬層;

進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一源極與一汲極,並同時去除部份之該掺雜半導體層,以曝露出該非晶矽層;以及

於該基板上形成一保護層。

- 14. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該表面處理製程係為一氧化氮(N₂O)電漿製程,以使該閘極絕緣層與後續形成之該微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 15. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該表面處理製程係為一含氧電漿製程,以使該閘極絕緣層與該微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 16. 如申請專利範圍第 15項之方法,其中該含氧電漿製程 包含有氧化氮 (NO_x) 、二氧化氮 (H_2O_2) 、氧 (O_2) 、臭氧 (U_3) 或四乙氧基矽烷 (TEOS)等製程氣體。
- 17. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該基板係為玻

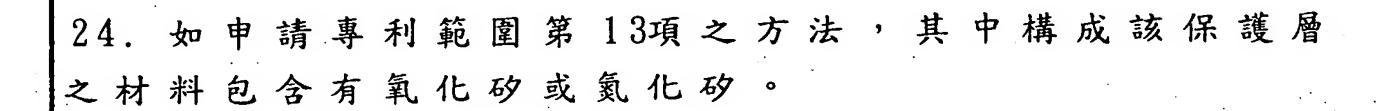


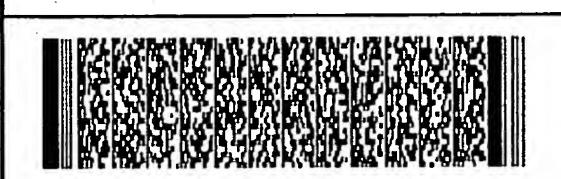
璃基板、石英基板或塑膠基板。

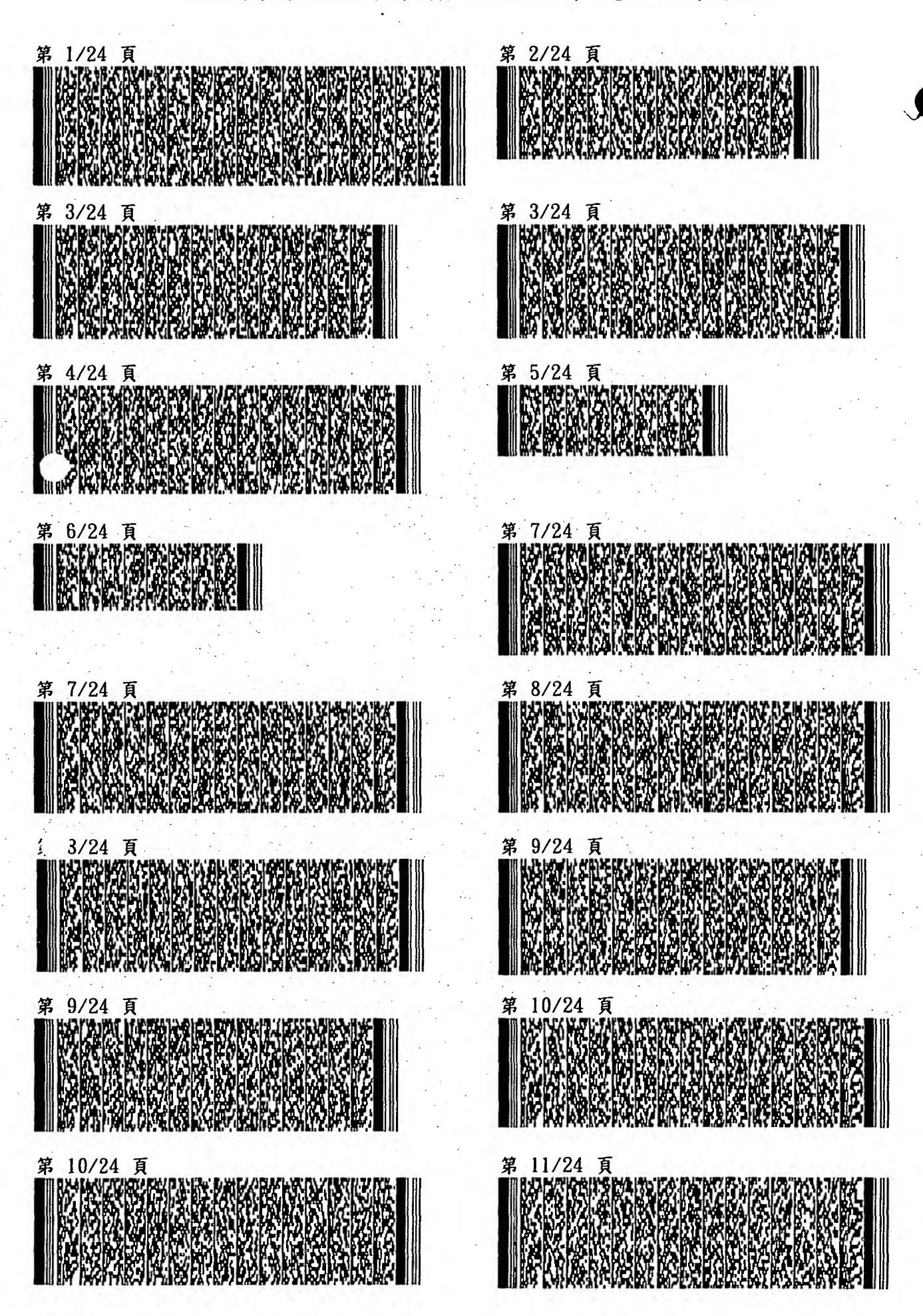
- 18. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中構成該第一與該第二金屬層的材料係包含有鷂(W)、鉻(Cr)、鋁(A1)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。
- 19. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該 開極絕緣層係利用一電漿增強化學氣相沈積製程所形成,且構成該 開極絕緣層的材料係包含有氧化矽(SiO_x)、氮化矽(SiN_y)或氮氧化矽(SiON)。
- 20. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該微晶矽層係利用一電漿增強化學氣相沈積製程所形成,且該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度小於0.54瓦特/平方公分。
- 21. 如申請專利範圍第20項之方法,其中該微晶矽層之厚度約50至500埃,且該微晶矽層之結晶比率(f_c)係大於40%。
- 2° 如申請專利範圍第13項之方法,其中該閘極絕緣層、該微晶矽層以及該非晶矽層皆係利用同一電漿增強化學氣相沈積(PECVD)製程連續沈積形成。

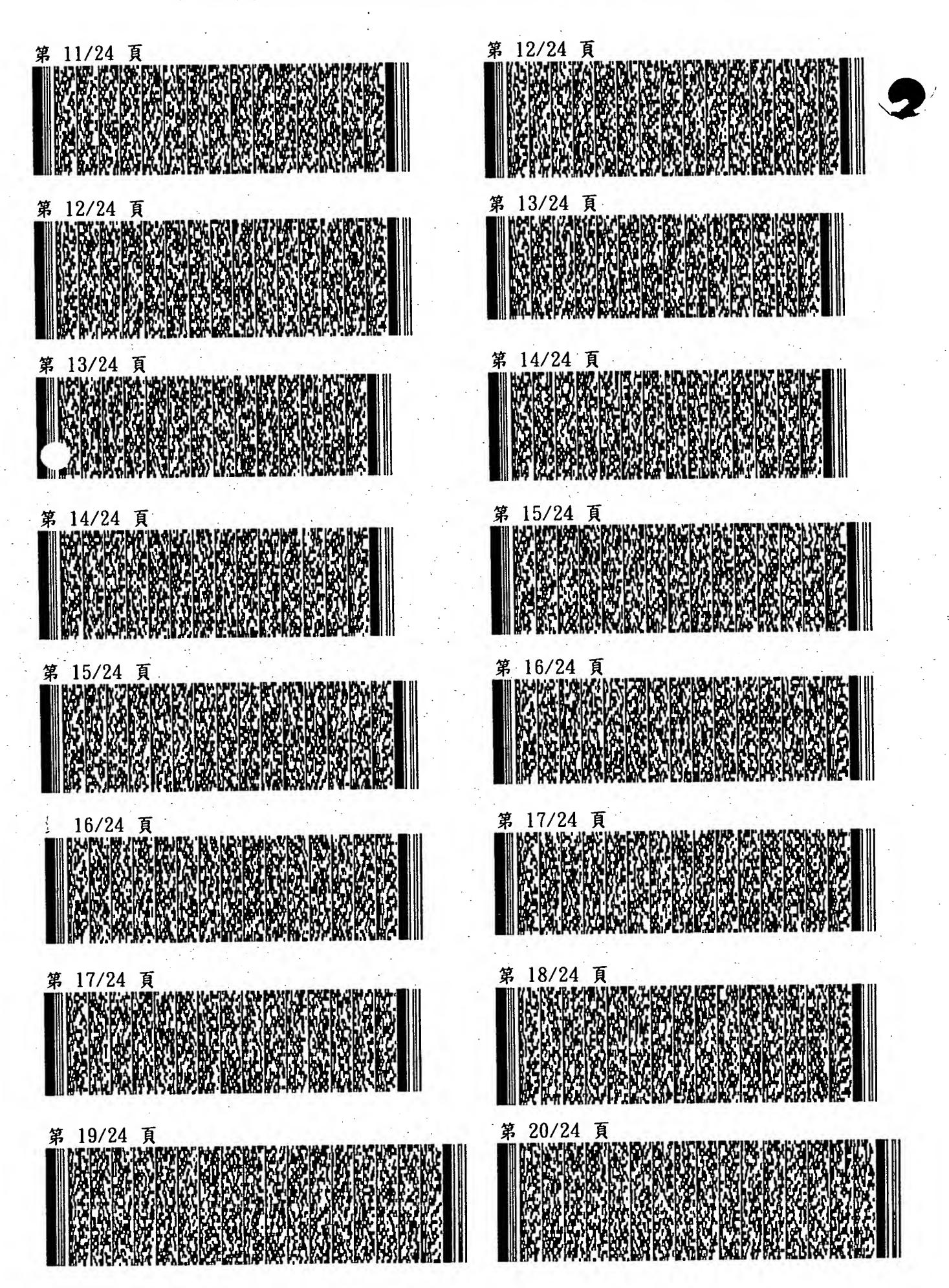


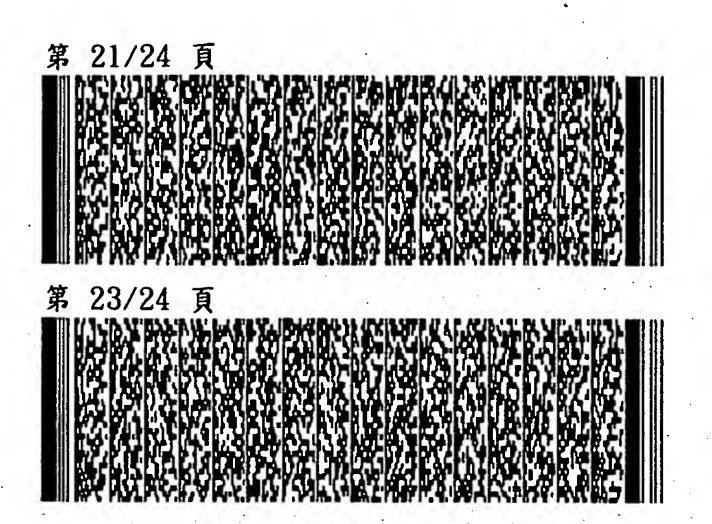
23. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該閘極絕緣層以及該微晶矽層係利用電漿增強化學氣相沈積製程非連續沈積形成。



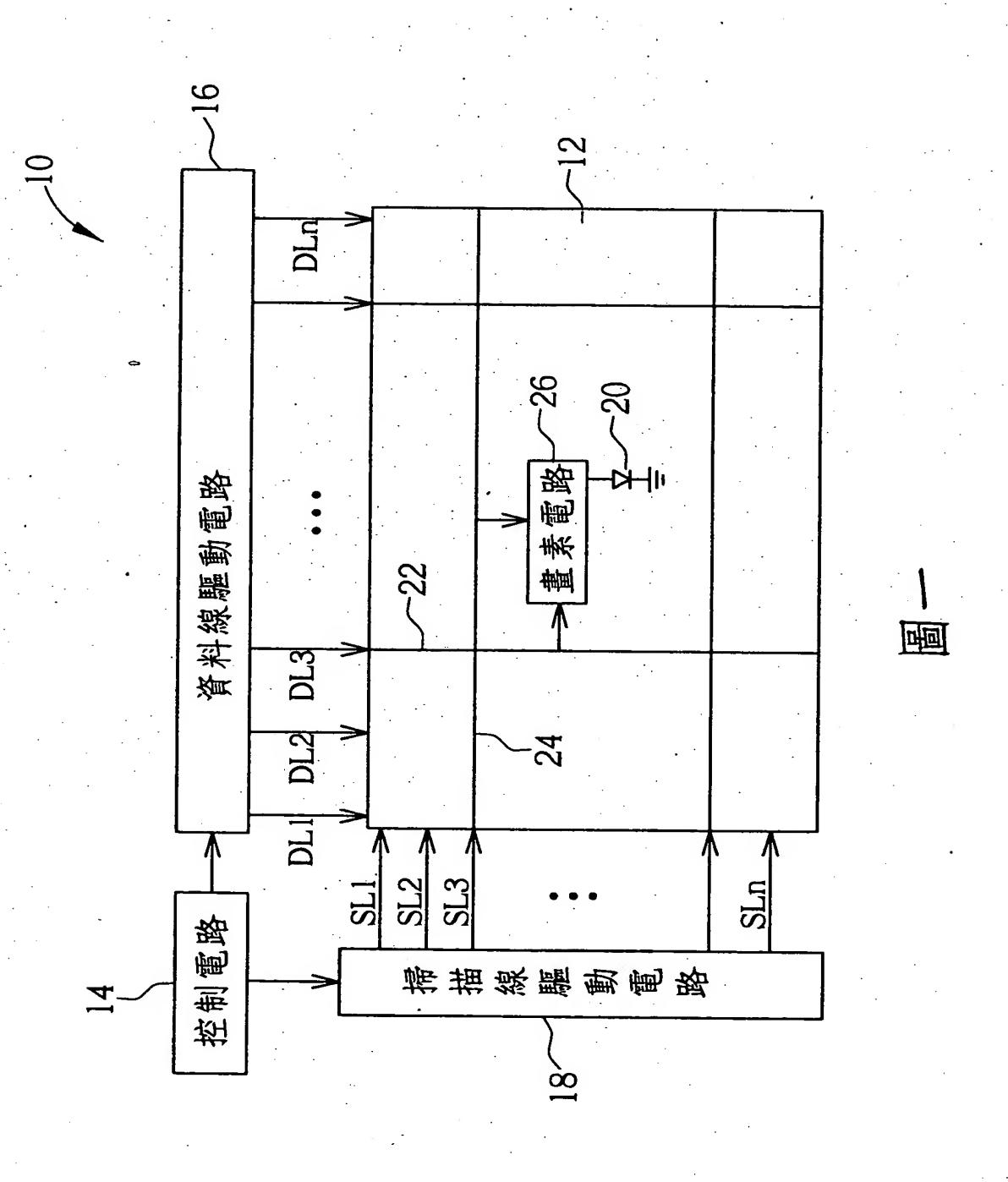




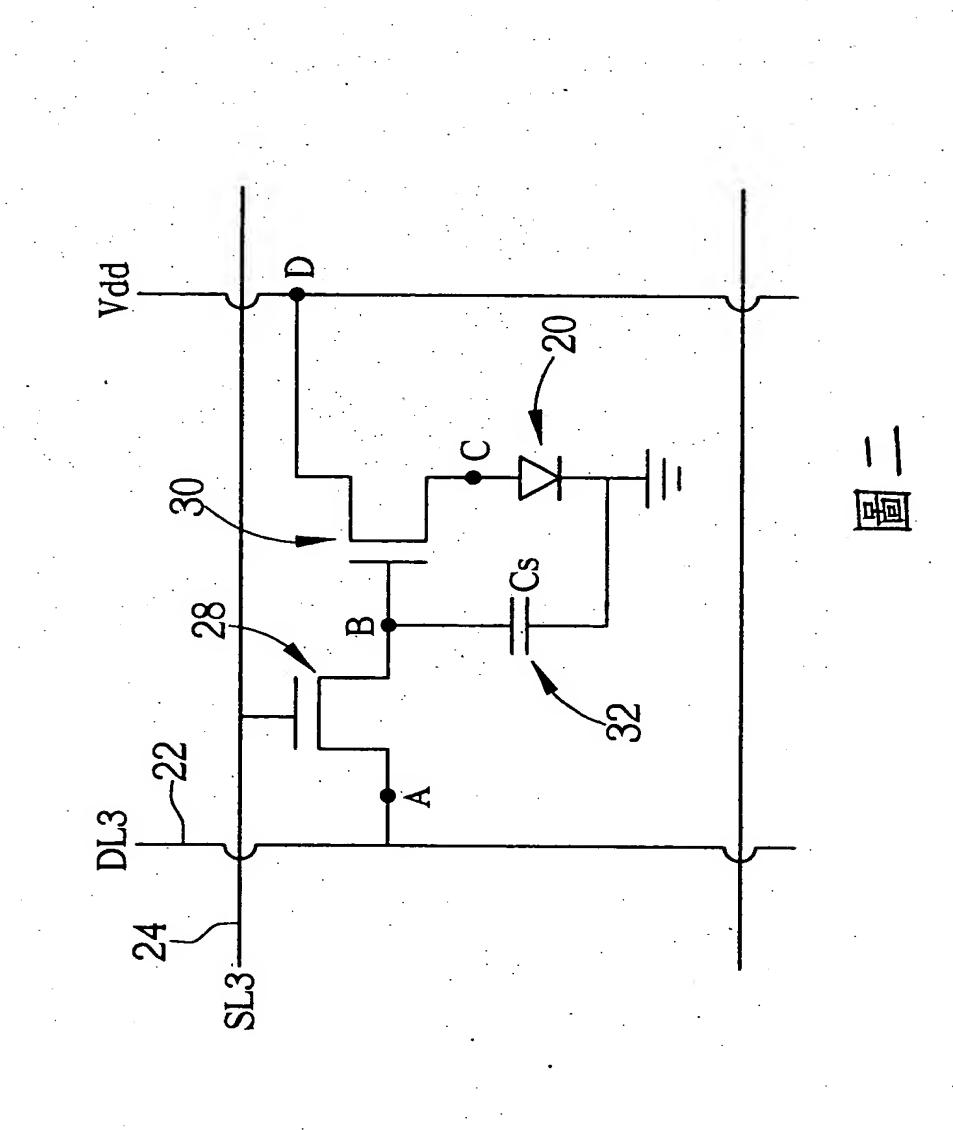




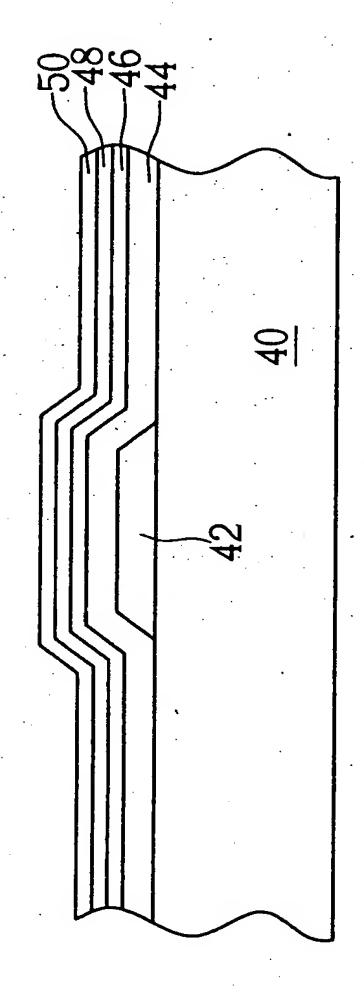


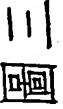


5A94116b











•

4

